



中华人民共和国国家标准

GB/T 5965—2000
idt IEC 748-2-1:1991
QC 790132

半导体器件 集成电路
第2部分:数字集成电路
第一篇 双极型单片数字集成电路
门电路(不包括自由逻辑阵列)
空白详细规范

Semiconductor devices—Integrated circuits—
Part 2: Digital integrated circuits—
Section one—Blank detail specification
for bipolar monolithic digital integrated circuit gates
(excluding uncommitted logic arrays)

2000-01-03 发布

2000-07-01 实施

国家质量技术监督局 发布

前 言

本标准等同采用国际电工委员会标准 IEC 748-2-1:1991《半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路 第一篇 双极型单片数字集成电路门电路(不包括自由逻辑阵列)空白详细规范》,以促进我国该类产品的国际贸易、技术和经济交流。

本标准与下列国家标准一起使用:

GB/T 4937—1995 《半导体器件 机械和气候试验方法》(idt IEC 749:1984 及修改单 1:1991)

GB/T 16464—1996 《半导体器件 集成电路 第1部分:总则》(idt IEC 748-1:1984)

GB/T 17574—1998 《半导体器件 集成电路 第2部分:数字集成电路》(idt IEC 748-2:1985 及修改单 1:1991)

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国集成电路标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位:电子工业部标准化研究所。

本标准主要起草人:李燕荣。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际上的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准。IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准由 IEC/TC47(半导体器件)的 SC47A(集成电路)制定。

本标准是双极型单片数字电路门电路空白详细规范。

本标准文本以下列文件为依据:

六个月法	表决报告	二个月程序	表决报告
47/47A(CO) 987/151	47/47A(CO) 1033/165, 1033A/165A	47A(CO)212	47A(CO)239

表决批准本标准的详细资料可在上表列出的表决报告中查阅。

本标准封面上的 QC 编号是 IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)的规范号。

本标准引用下列 IEC 标准:

68-2-17(1978) 环境试验 第 2 部分:试验——试验 Q 密封

617-12(1991) 图形符号 第 12 部分:二进制逻辑单元

747-10(1984) 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

748-1(1984) 半导体器件 集成电路 第 1 部分:总则

748-2(1985) 半导体器件 集成电路 第 1 部分:数字集成电路 修改单 1(1991)

748-11(1990) 半导体器件 集成电路 第 11 部分:半导体集成电路分规范(不包括混合电路)

749(1984) 半导体器件 机械和气候试验方法 修改单 1(1991)

QC 001002(1986) IEC 电子元器件质量评定体系(IECQ)程序规则

中华人民共和国国家标准

半导体器件 集成电路

第 2 部分:数字集成电路

第一篇 双极型单片数字集成电路

门电路(不包括自由逻辑阵列)

空白详细规范

GB/T 5965—2000
idt IEC 748-2-1:1991
QC 790132
代替 GB/T 5965—1986

Semiconductor devices—Integrated circuits—
Part 2:Digital integrated circuits—
Section one—Blank detail specification
for bipolar monolithic digital integrated circuit gates
(excluding uncommitted logic arrays)

引言

IEC 电子元器件质量评定体系遵循 IEC 的章程,并在 IEC 授权下进行工作。该体系的目的是确定质量评定程序,以这种方式使一个参加国按有关规范要求放行的电子元器件无需进一步试验而为其他所有参加国同样接受。

本空白详细规范是半导体器件的一系列空白详细规范之一,并且与下列标准一起使用。

IEC 747-10/QC 700000 半导体器件 第 10 部分:分立器件和集成电路总规范

要求的资料

本页和下页括号内的数字与下列各项要求的资料相对应,这些资料应填写在相应的栏中。

详细规范的识别

- [1] 授权发布详细规范的国家标准化机构名称。
- [2] 详细规范的 IECQ 编号。
- [3] 总规范、分规范的编号及版本号。
- [4] 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的其他资料。

器件的识别

- [5] 主要功能和型号。
- [6] 典型结构(材料、主要工艺)和封装资料。
如果器件具有若干种派生产品,则应指出其差别,例如用对照表列出特性差异。
如果器件属静电敏感型,应在详细规范中注明注意事项。
- [7] 外形图、引出端识别、标志和/或有关外形的参考文件。
- [8] 按总规范 2.6 的质量评定类别。
- [9] 参考数据。

[本规范下面方括号给出的条款构成了详细规范的首页,这些条款仅供指导详细规范的编写,而不